

電界放出形透過電子顕微鏡 JEM-2100F

製造元	日本電子(株) 製造年度：2009 年度
仕様	観察モード： TEM、STEM EDS 分析： 可能 電子銃： ショットキー型電子銃 加速電圧： 200 kV TEM 分解能 粒子像（点分解能）： 0.25 nm 格子像： 0.1 nm STEM 分解能： 0.2 nm 試料傾斜： Tilt-X $\pm 42^\circ$ Tilt-Y $\pm 30^\circ$
保有部署	材料工学専攻
設置場所	吉田・工学部物理系校舎・地下1階020室
利用期間・時間、 利用料金	本設備の共同利用規程を参照 https://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/research/yui/naiki/20210210-zaiko
注意事項等	予約可能範囲は2週間先までで、その範囲内で各人1枠のみ予約可能。
連絡先	材料工学専攻 教育研究支援室 技術職員 鹿住健司 075-753-5474 kazumi.kenji.6r@kyoto-u.ac.jp
キーワード	TEM、STEM、EDS、電子回折、組成分析
機器コード	0000103009
自由記入欄	CCD カメラはボトムマウントであるため高分解能 TEM 像の取得も可能。

令和6年10月10日現在

